

# Mikroskopische Bestimmung thermischer und struktureller Eigenschaften dünner Schichten durch modifizierte Raster-Sonden-Verfahren

## Motivation

Analytik dünner und ultra- dünner Schichten

## Vorgehen

Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit dünner Schichten. Ziel des geplanten Vorhabens ist die Entwicklung, der Bau und die Erprobung eines Zusatzmoduls (Add-on Modul) für Raster-Sonden-Mikroskope (RSM) zur thermischen Charakterisierung dünner Schichten und nanostrukturierter Materialien wie sie beispielsweise für Thermogeneratoren benötigt werden. Im Rahmen des beantragten Vorhabens soll das Modul in Verbindung mit bereits etablierten Mess- und Charakterisierungsmethoden eingesetzt werden.

## Eckdaten

### Kurztitel

3 $\omega$ -Microscopy

### Forschungsschwerpunkt

Sustainable Production, Energy Technologies and Smart Materials

### Laufzeit

01.09.2012 - 31.08.2015

### Fördergeber

Bundesministerium für Bildung und Forschung

### Projektleitung

Prof. Dr.-Ing. Günther Benstetter

